说明：

一、判断是否进入跳转模式：

打印返回：

（1)进入跳转模式，并且init data bin跳转校验和 fact test info校验成功

esp\_set\_flash\_jump\_chk\_ok[XX:XX:XX:XX:XX:XX]

（2）esp\_set\_flash\_jump\_chk\_ok\_fail，err\_code:1（不是跳转模式）

或esp\_set\_flash\_jump\_chk\_ok\_fail，err\_code:2（init data bin跳转校验失败）

或esp\_set\_flash\_jump\_chk\_ok\_fail，err\_code:3（ fact test info校验失败）

二、进行模组测试

esp\_set\_flash\_jump\_start <param1>

<param1>：1，代表使能 模组测试程序

例如指令：esp\_set\_flash\_jump\_start 1

（1）返回：fact test start ok

表示：模组测试程序正常（fact test info校验成功且测试次数大于0，并且测试次数自减1，且回写flash成功）。

（2）返回：fact test start fail

表示：模组测试程序异常（fact test info校验失败，或测试次数=0，或写flash失败）。

三、回写pass信息

esp\_set\_flash\_test\_pass\_info <param1> <param1> <param2> <param3> ... <param17>

<param1> ... <param17>:17byte的回写log参数，有效位为低byte

例如指令：esp\_set\_flash\_test\_pass\_info 0x12 0x34 0x56 0x78 0x89 0xab 0xcd 0xef 0xaa

返回打印：

（1）esp\_set\_fac\_info\_pass（回写成功）

（2）esp\_set\_fac\_info\_fail（回写失败）

四、读128bit EFUSE

例如指令：esp\_read\_efuse\_128bit

返回：esp\_read\_efuse\_128bit:0x12345678,0x55556666,0x33332222,0x10108989,

返回的<param0> ~ <param3> 说明：

表示：128bit位烧写的值，<param0>表示：efuse的[31:0]；<param1>表示efuse的[63:32]；

<param2>表示efuse的[95:64]；<param3>表示efuse的[127:96]。

附：

0x3ff00050的[31:0]对应efuse的[31:0],低位对应低位;

0x3ff00054的[31:0]对应efuse的[63:32],低位对应低位;

0x3ff00058的[31:0]对应efuse的[95:64],低位对应低位;

0x3ff0005C的[31:0]对应efuse的[127:96],低位对应低位;